

Резонансное упругое рассеяние света квантовой ямой со статистически неровными границами

© В.А. Кособукин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,
194021 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: Vladimir@polar.ioffe.rssi.ru

(Поступила в Редакцию 21 июля 1998 г.)

Построена теория упругого рассеяния света через состояния квазидвумерных экситонов в квантовой яме со случайно неровными стенками. Нелокальная экситонная восприимчивость выражена через случайные функции формы границ квантовой ямы с точностью до линейных членов по высоте неровностей. В борновском приближении при произвольной статистике неровностей вычислены сечения резонансного упругого рассеяния света для всех каналов, в которых начальное и конечное состояния представлены электромагнитной волной ТМ или ТЕ типа. Спектральные и угловые зависимости вероятности рассеяния рассчитаны с гауссовыми корреляционными функциями неровностей. Из численных оценок следует, что упругое рассеяние в квантовых ямах должно наблюдаться при среднеквадратичной высоте неровностей порядка толщины атомного монослоя.

Многие оптические свойства низкоразмерных экситонов в структурах с квантовыми ямами находят объяснение в предположении, что гетерограницы идеально плоские [1–3]. В этом случае вторичное излучение может отклоняться только в зеркальных направлениях по отношению к падающей волне, так как сохраняется составляющая волнового вектора в плоскости квантовой ямы. Эффекты отражения и пропускания света описываются в рамках метода матриц переноса, развитого в [3] с учетом нелокальности экситонного отклика квантовых ям. Однако реальные квантовые ямы имеют неустраняемые структурные несовершенства, среди которых наиболее существенными считаются случайные отклонения гетерограниц от плоскости [4]. Неровности стенок квантовой ямы делают случайно неоднородными ее ширину и поле поляризации, и, таким образом, становятся причиной рассеяния света.

Теоретическому изучению роли статистически неровных гетерограниц в оптике экситонов было посвящено сравнительно немного работ. В основном они касались неоднородного уширения экситонных спектров в структурах с квантовыми ямами [5], прохождения света [6], спектроскопии экситонной люминесценции с временным разрешением [7] и упругого рассеяния света [8]. Обычно [5–7] эффекты неровностей обсуждаются в терминах случайного "потенциала", действующего на движение центра массы экситона, причем наблюдаемые величины выражаются через статистические характеристики такого потенциала. Из-за физической неопределенности последнего, как правило, остаются без ответа важные вопросы о локализации экситонов и связи между статистическими параметрами гетерограниц и потенциальной энергии экситона.

Цель данной работы — построение теории стационарного резонансного упругого рассеяния света экситонами квантовой ямы со статистически неровными стенками. Вместо введения случайного потенциала, действующего на экситон, предлагается модельное обобщение экситон-

ной восприимчивости, при котором явно учитывается геометрия случайно неровных границ квантовой ямы [8]. Считается, что неровности малы по высоте и имеют большой радиус корреляции в плоскости квантовой ямы, при этом их влияние на частоту перехода и волновую функцию экситона рассматривается как возмущение. Такая модель крупномасштабных флуктуаций формы границ квантовой ямы в значительной мере аналогична модели, объясняющей упругое рассеяние света шероховатой поверхностью полупроводника в области его экситонных резонансов [9].

1. Описание модели

Квантовую яму со случайно неровными границами принято рассматривать как совокупность областей (островков), в каждой из которых ширина ямы может считаться постоянной. Размеры островков в латеральных направлениях могут составлять от десятков до сотен ангстрем [4]. Поэтому поперечное сечение светового пучка в оптическом эксперименте охватывает одновременно большое число островков, которые таким образом составляют статистический ансамбль. Указанные выше структурные особенности квантовой ямы со статистически неэквивалентными границами [4] отражены в модели, показанной на рис. 1. Форма границ квантовой ямы описывается уравнениями $z = -\bar{L}/2 + \xi_1(\mathbf{R})$ и $z = \bar{L}/2 + \xi_2(\mathbf{R})$, где $\mathbf{R} = (x, y)$, $\mathbf{r} = (\mathbf{R}, z)$, \bar{L} — средняя ширина ямы. Случайные функции $\xi_n(\mathbf{R})$ формы n -й границы раздела ($n = 1, 2$) имеют среднее значение $\langle \xi_n(\mathbf{R}) \rangle = 0$, где угловыми скобками обозначается усреднение по ансамблю $\{\xi_n(\mathbf{R})\}$. Функции

$$\xi_{\pm}(\mathbf{R}) = \xi_2(\mathbf{R}) \pm \xi_1(\mathbf{R}) \quad (1)$$

локально определяют ширину квантовой ямы

$$L(\mathbf{R}) = \bar{L} + \xi_{-}(\mathbf{R}) \quad (2)$$

и положение ее центра $z = \xi_{+}(\mathbf{R})/2$.

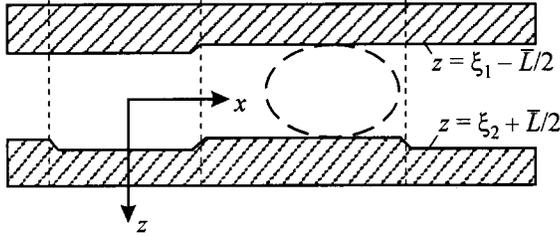


Рис. 1. Схематическое изображение квантовой ямы с неровными стенками. Области постоянной ширины ямы разделены вертикальными линиями, в одной из областей условно показан эпитон.

Если поперечный радиус корреляции неровностей в плоскости ямы превосходит борковский радиус эпитона, то квазидвумерный эпитон сохраняет свою индивидуальность по отношению к неограниченной квантовой яме той же ширины. При этом материальное уравнение, связывающее при заданной частоте ω эпитонную поляризацию \mathbf{P} с полным электрическим полем \mathbf{E} [10, 11], обобщается следующим образом:

$$4\pi P_\alpha(z, \mathbf{R}; \omega) = \frac{A_\alpha}{\omega_0(\mathbf{R}) - \omega - i\gamma} \psi\left(z - \frac{\xi_+(\mathbf{R})}{2}\right) \times \int dz' \psi\left(z' - \frac{\xi_+(\mathbf{R})}{2}\right) E_\alpha(z', \mathbf{R}; \omega). \quad (3)$$

Здесь введены медленные параметрические зависимости от \mathbf{R} частоты эпитонного перехода $\omega_0(\mathbf{R})$ и огибающей волновой функции эпитона $\psi(z - \xi_+/2)$, причем последняя описывает изгиб квантовой ямы. В (3) $\psi(z) = \psi(-z)$ для основного эпитонного состояния, γ — параметр нерадационного затухания эпитона, а величина A_α пропорциональна анизотропной силе осциллятора перехода [10], зависимостью которой от L [12] пренебрегаем.

В результате преобразования Фурье

$$\mathbf{E}(z; \mathbf{K}, \omega) = \int d^2R \exp(-i\mathbf{K} \cdot \mathbf{R}) \mathbf{E}(z; \mathbf{R}, \omega) \quad (4)$$

из соотношения (3) получаем

$$4\pi P_\alpha(z; \mathbf{K}, \omega) = \int dz' \int \frac{d^2K'}{(2\pi)^2} \chi^{(\alpha)}(z, z'; \mathbf{K} - \mathbf{K}', \omega) \times E_\alpha(z'; \mathbf{K}', \omega), \quad (5)$$

где

$$\chi^{(\alpha)}(z, z'; \mathbf{K} - \mathbf{K}', \omega) = (2\pi)^2 \delta(\mathbf{K} - \mathbf{K}') \psi(z) \times \chi_0^{(\alpha)}(\omega) \psi(z') + \delta\chi^{(\alpha)}(z, z'; \mathbf{K} - \mathbf{K}', \omega). \quad (6)$$

Здесь выделена трансляционно-симметричная по \mathbf{R} часть, в которой

$$\chi_0^{(0)}(\omega) = \frac{A_\alpha}{\bar{\omega}_0 - \omega - i\gamma} \equiv \frac{A_\alpha}{\Delta_0(\omega)} \quad (7)$$

описывает резонансный отклик "средней" квантовой ямы с плоскими поверхностями $z = \pm \bar{L}/2$ и частотой $\bar{\omega}_0$.

В случае малых неровностей $\langle \xi_n^2 \rangle^{1/2} \ll \bar{L}$ величину $\delta\chi^{(\alpha)}$ в (6) удобно разложить по ξ_\pm с точностью до линейных членов; для этого требуется выполнение дополнительного условия $\langle \delta\omega_0^2 \rangle^{1/2} < \gamma$, где

$$\delta\omega_0(\mathbf{R}) = \omega_0(\mathbf{R}) - \bar{\omega}_0. \quad (8)$$

Случайную поправку (8) к частоте $\bar{\omega}_0$, связанную с вариацией ширины квантовой ямы (2), определим формулой

$$\delta\omega_0(\mathbf{R}) \approx \{\partial\omega_0/\partial L\}_{L=\bar{L}} \xi_-(\mathbf{R}) = -\Omega \xi_-(\mathbf{R})/\bar{L}, \quad (9)$$

справедливой при $\langle \delta\omega_0^2 \rangle^{1/2} \ll \bar{\omega}_0$. С учетом (7)–(9) находим, что в (6)

$$\delta\chi^{(\alpha)}(z, z'; \mathbf{K} - \mathbf{K}'; \omega) = \chi_0^{(\alpha)}(\omega) \sum_\sigma a_\sigma(\omega) F_\sigma(z, z') \frac{\xi_\sigma(\mathbf{K} - \mathbf{K}')}{\bar{L}}. \quad (10)$$

Здесь $\xi_\sigma(\mathbf{K})$ — результат преобразования Фурье (4) функции $\xi_\sigma(\mathbf{R})$, σ означает знак (+) или (–) в соответствии с выражением (1),

$$a_- = \Omega/\Delta_0(\omega), \quad F_-(z, z') = \psi(z)\psi(z'), \quad (11)$$

$$a_+ = -1,$$

$$F_+(z, z') = \frac{\bar{L}}{2} \left\{ \psi(z) \frac{d\psi(z')}{dz'} + \frac{d\psi(z)}{dz} \psi(z') \right\}. \quad (12)$$

В соотношении (3) энергия эпитонного перехода, зависящая от локальной ширины квантовой ямы (2), равна

$$\hbar\omega_0(L) = E_{gap} + E_{conf}(L) - E_{bind}(L). \quad (13)$$

Здесь E_{gap} — ширина запрещенной зоны полупроводника, E_{conf} — суммарная энергия пространственного квантования несвязанных электрона и дырки, а E_{bind} — энергия их связи в эпитоне. Для участка квантовой ямы (островка) с размерами $D_X \times D_Y \times L$ в модели бесконечно высоких барьеров энергия низшего уровня размерного квантования носителей определяется выражением

$$E_{conf}(L) = (\pi\hbar)^2 \beta / (2\mu L^2).$$

Здесь μ — приведенная электронно-дырочная масса, а размерно-зависимая константа лежит между $\beta = 1$ (неограниченная яма с $D_X \rightarrow \infty, D_Y \rightarrow \infty$) и $\beta = 3$ (яма в форме куба с $D_X = D_Y = L$). Отсюда

$$\hbar\Omega_{conf} = (\pi\hbar)^2 \beta / (\mu \bar{L}^2) = 2\pi^2 \beta E_B (a_B/\bar{L})^2, \quad (14)$$

где E_B и a_B — энергия и радиус объемного эпитона. В неограниченной квантовой яме с бесконечными барьерами энергия связи эпитона $E_{bind}(L)$ как функция L

монотонно убывает от $E_{bind}(0) = 4E_B$ до $E_{bind}(\infty) = E_B$, при этом $\hbar\Omega_{bind} \approx E_B$. Поэтому $\Omega_{bind} \ll \Omega_{conf}$ при $\bar{L} \approx a_B$, и $\Omega \approx \Omega_{conf}$ в (9). В квантовых ямах GaAs для экситона тяжелой дырки $1e-1hh$ величина $\hbar\Omega_{conf}$ уменьшается примерно от $1.5 \cdot 10^2$ meV при $\bar{L} = 100$ Å до 20 meV при $\bar{L} = 300$ Å, а для экситона легкой дырки $1e-1lh$ она примерно в $\mu_{hh}/\mu_{lh} \approx 1.4$ раз больше. В свою очередь, в интервале $100 < \bar{L} < 300$ Å величина $\hbar\Omega_{bind} \approx 2$ meV для экситона $1e-1hh$ и примерно в $\mu_{hh}/\mu_{lh} \approx 1.4$ раз меньше для состояния $1e-1lh$. Эти выводы нетрудно подтвердить и для барьеров конечной высоты, используя зависимости $\hbar\Omega_{bind}(L)$ из [13] и соответствующие $\hbar\Omega_{conf}(L)$, но Ω в (9) несколько уменьшается из-за туннелирования носителей под барьер. Заметим также, что в резонансном знаменателе выражения (3) был опущен связанный с пространственной дисперсией экситона член $\hbar\kappa^2/[2(m_e + m_h)]$, который мал по сравнению с $\langle \delta\omega_0^2 \rangle^{1/2}$.

Таким образом, сформулирована модель, в которой экситонная восприимчивость квантовой ямы и связанные с ней наблюдаемые оптические величины выражаются непосредственно через статистические характеристики гетерограниц. В дальнейшем восприимчивости (6) рассматривается как возмущение, причем вклад (7) в нее учитывается самосогласованно, а (10) — в первом порядке теории возмущений по высоте неровностей.

2. Электродинамика "средней" квантовой ямы

Предположим, что в среде с фоновой диэлектрической постоянной ε_b на квантовую яму под углом θ к нормали (ось z) падает монохроматическая (с частотой ω) волна с электрическим полем

$$\mathbf{E}^0(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_\lambda \cdot E_\lambda^{inc} \exp[-i\omega t + i(\kappa x + k_z z)]. \quad (15)$$

Здесь $\mathbf{K} = \kappa \mathbf{e}_x$, $\kappa = \sqrt{\varepsilon_b k_0} \sin \theta$ и $k_z(\kappa) = \sqrt{\varepsilon_b k_0^2 - \kappa^2}$, $k_0 = \omega/c$, c — скорость света. Индекс λ обозначает линейные поляризации p (ТМ волна) или s (ТЕ волна), для которых орты \mathbf{e}_λ в (15) равны $\mathbf{e}_p = (\cos \theta, 0, -\sin \theta)$ и $\mathbf{e}_s = (0, 1, 0)$ соответственно.

Уравнения электродинамики для электрического поля $\mathbf{E}(z; \mathbf{K}, \omega)$ и функцией Грина $G_{\alpha\beta}(z, z'; \mathbf{K}, \omega)$ с учетом нелокального отклика (6) при $\delta\chi^{(\alpha)} = 0$ решаем самосогласованно, следуя обычной процедуре [3, 11, 14]. Это дает, в частности, комплексную частоту $\omega_\alpha(\kappa) - i\Gamma_\alpha(\kappa) - i\gamma$ квазидвумерного экситона с учетом электромагнитной перенормировки. Скорость радиационного распада экситона выражается в виде [14]

$$\Gamma_\alpha(\kappa) = \Gamma_\alpha^0 f_\alpha(\kappa),$$

$$\mathbf{f} = \left\{ |\cos \theta|, |\cos \theta|^{-1}, |\cos \theta|^{-1} - |\cos \theta| \right\} I_c^2(\kappa) / I_c^2(0), \quad (16)$$

где Γ_α^0 — скорости радиационного распада экситона при нормальном падении, анизотропия которых учиты-

вается в следующей форме: $\Gamma_X^0 = \Gamma_Y^0 = \Gamma_{||}^0 \neq \Gamma_{\perp}^0 = \Gamma_Z^0$ [10, 11]. Радиационные сдвиги соответствующих частот экситонного перехода $\omega_\alpha(\kappa)$ относительно $\bar{\omega}_0$ незначительны [3, 14], поэтому далее будет учитываться только расщепление частот $\omega_Z - \omega_X = 2\Gamma_Z^0 I_0 / [\sqrt{\varepsilon_b} k_0 I_c^2(0)]$, имеющее электромагнитную природу. Здесь $I_c(\kappa) = \int dz \cos[k_z(\kappa)z] \psi(z) = \int dz \exp[\pm i k_z z] \psi(z)$ и $I_0 = \int dz \psi^2(z)$, причем $I_c(\kappa)/I_c(0) \approx 1$ в длинноволновом приближении $k_z \bar{L} \ll 1$ рассматриваемой далее задачи рассеяния.

3. Рассеяние света неровностями интерфейсов

При учете (1) в первом порядке теории возмущений по ξ_n (борновское приближение) для электрического поля рассеянного света получаем

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_\alpha(\mathbf{r}, \omega) = & -k_0^2 \sum_\beta \chi_0^{(\beta)}(\omega) \int \frac{d^2 \mathbf{K}'}{(2\pi)^2} \exp(i\mathbf{K}' \cdot \mathbf{R}) \\ & \times \sum_\sigma a_\sigma \frac{\xi_\sigma(\mathbf{K}' - \mathbf{K})}{\bar{L}} \int dz' G_{\alpha\beta}(z, z'; \mathbf{K}', \omega) \\ & \times \int dz'' F_\sigma(z', z'') E_\beta(z''; \mathbf{K}, \omega). \end{aligned} \quad (17)$$

Здесь $\mathbf{K} = \mathbf{e}_x \kappa$ и $\mathbf{K}' = (\mathbf{e}_x \cos \varphi' + \mathbf{e}_y \sin \varphi') \kappa'$ — двумерные составляющие волновых векторов падающей и рассеянной плоских волн с $(\kappa, \kappa') = \sqrt{\varepsilon_b} k_0 (\sin \theta, \sin \theta')$ соответственно, а $G_{\alpha\beta}(z, z'; \mathbf{K}', \omega)$ — компоненты тензорной функции Грина, обсуждавшейся в разделе 2.

Вычислим вектор Пойнтинга для поля (17) рассеянного света и усредним результат по ансамблям реализаций $\{\xi_n\}$. В асимптотической области $|z| \rightarrow \infty$ это дает

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{S}(\mathbf{r}) \rangle = & \frac{c\sqrt{\varepsilon_b} k_0^4}{8\pi} \text{Re} \left\{ \int \frac{d^2 \mathbf{K}'}{(2\pi)^2} \mathbf{N}(\mathbf{K}') \right. \\ & \times \sum_{\alpha, \beta, \gamma} \int dz_1 \dots dz_4 G_{\alpha\beta}(z, z_1; \mathbf{K}') \chi_0^{(\beta)} E_\beta(z_3; \mathbf{K}) \\ & \times [G_{\alpha\gamma}(z, z_2; \mathbf{K}') \cdot \chi_0^{(\gamma)} \cdot E_\gamma(z_4; \mathbf{K})]^* \\ & \left. \times \sum_{\sigma, \tau} \frac{Q_{\sigma\tau}(\mathbf{K}' - \mathbf{K})}{\bar{L}^2} a_\sigma a_\tau^* F_\sigma(z_1, z_3) F_\tau(z_2, z_4) \right\}, \end{aligned} \quad (18)$$

где $\mathbf{N}(\mathbf{K}) = \left\{ \mathbf{K} / (\sqrt{\varepsilon_b} k_0) + \mathbf{e}_z |\cos \theta| \text{sgn}(z) \right\}$. Матричные элементы $Q_{\sigma\tau}(\mathbf{K})$ выражаются через функции $g_{mn}(|\mathbf{K}|)$, которые входят в фурье-компоненты

$$\langle \xi_m(\mathbf{K}') \xi_n(\mathbf{K}) \rangle = h_m h_n g_{mn}(|\mathbf{K}|) (2\pi)^2 \delta(\mathbf{K}' - \mathbf{K}) \quad (19)$$

корреляционных функций

$$\langle \xi_m(\mathbf{R}) \xi_n(\mathbf{R}') \rangle = h_m h_n g_{mn}(|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|). \quad (20)$$

Выражения (19) и (20) предполагают, что неровности границ квантовой ямы в среднем однородны и изотропны в плоскости квантовой ямы. В (20) $h_n^2 = \langle \xi_n^2(\mathbf{R}) \rangle$ и $g_{mn}(|\mathbf{R}|) = \langle \xi_m(\mathbf{R})\xi_n(0) \rangle / h_m h_n$ суть дисперсия высоты неровностей и функция корреляции их формы, причем $\int d^2K g_{mn}(\mathbf{K}) / (2\pi)^2 = 1$ для фурье-компонент.

Анализ выражения (18) показывает [8], что вклад в рассеяние, обусловленный изгибом квантовой ямы, может существенно проявиться только при $\xi_1 = \xi_2$, т.е. в случае коррелированных границ. В общем случае $\xi_1 \neq \xi_2$ доминирует вклад в рассеяние, связанный с пространственным изменением ширины квантовой ямы (энергии размерного квантования носителей). Действительно, в первых, вблизи резонансной частоты $|\Delta_\alpha| \approx \gamma + \Gamma_\alpha \ll \Omega$, и следовательно $|a_-/a_+| \approx \Omega/\gamma \gg 1$ в (11) и (12) (вдали от резонанса рост величин $|\Delta_\alpha|$ ограничивается такими же знаменателями функций E_α и $G_{\alpha\beta}$, входящих в выражение (18)). Во-вторых, вклад с $\sigma = (+)$ в (17) имеет дополнительный параметр малости $\sim \sqrt{\varepsilon_b} k_0 \bar{L} \ll 1$, возникающий при свертке функций электромагнитного поля, имеющих фазовые множители $\exp(\pm ik_z z)$, с функциями $d\psi(z)/dz$ из (12).

Перейдем, следуя работам [9, 15], к дифференциальной величине (18) и нормируем ее на модуль вектора Пойнтинга падающей волны $S_\chi^{inc} = c\sqrt{\varepsilon_b}|E_\chi^{inc}|^2 \cos\theta / (8\pi)$. При этом учитываем только вклад, связанный с изменением ширины квантовой ямы, т.е. $\sigma = \tau = (-)$ в (18). Тогда для безразмерных дифференциальных сечений рассеяния света из начального состояния (λ, \mathbf{K}) в конечное (λ', \mathbf{K}') находим

$$\frac{dw(s \rightarrow s)}{d\Omega'} = |L_Y(\kappa')|^2 |L_Y(\kappa)|^2 W(\mathbf{K}'\mathbf{K}) \cos^2 \varphi', \quad (21)$$

$$\frac{dw(s \rightarrow p)}{d\Omega'} = |L_X(\kappa')|^2 |L_Y(\kappa)|^2 W(\mathbf{K}'\mathbf{K}) \sin^2 \varphi', \quad (22)$$

$$\frac{dw(p \rightarrow s)}{d\Omega'} = |L_Y(\kappa')|^2 |L_X(\kappa)|^2 W(\mathbf{K}'\mathbf{K}) \sin^2 \varphi', \quad (23)$$

$$\begin{aligned} \frac{dw(p \rightarrow p)}{d\Omega'} = & \left\{ |L_X(\kappa')|^2 |L_X(\kappa)|^2 \cos^2 \varphi' + |L_Z(\kappa')|^2 \right. \\ & \times |L_Z(\kappa)|^2 + 2\text{Re} \left[L_X(\kappa') L_Z^*(\kappa') L_X(\kappa) \right. \\ & \left. \left. \times L_Z^*(\kappa) \right] \text{sgn}(z) \cos \varphi' \right\} W(\mathbf{K}'\mathbf{K}). \end{aligned} \quad (24)$$

Здесь $d\Omega' = \sin\theta' d\theta' d\varphi'$ — элемент телесного угла для рассеяния, а функции

$$\begin{aligned} L_\alpha(\kappa, \omega) &= \frac{\sqrt{\Omega \cdot \Gamma_\alpha(\kappa)}}{\omega_\alpha(\kappa) - i\Gamma_\alpha(\kappa) - i\gamma - \omega} \\ &\equiv \frac{\sqrt{\Omega \cdot \Gamma_\alpha(\kappa)}}{\Delta_\alpha(\kappa, \omega)} \end{aligned} \quad (25)$$

с параметрами, определенными в разделе 2, описывают резонансные особенности возбуждения квазидвумерных экситонов и излучения фотонов.

Статистические характеристики неровностей входят в величины

$$\begin{aligned} W(\mathbf{K}', \mathbf{K}) &= \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{\sqrt{\varepsilon_b} k_0}{\bar{L}} \right)^2 \\ &\times \left\{ h_1^2 g_{11} + h_2^2 g_{22} - h_1 h_2 [g_{12} + g_{21}] \right\}, \end{aligned} \quad (26)$$

где $g_{mn}(|\mathbf{K}' - \mathbf{K}|)$ — функции из выражения (19).

4. Влияние поверхности образца

В эксперименте образцы ограничены, а свет падает из вакуума и там же регистрируется вторичное излучение. В случае плоской поверхности полупроводника доступными для измерений в вакууме оказываются только те из рассмотренных выше волн, которые удовлетворяют условиям $\theta, \theta' < \arcsin \sqrt{1/\varepsilon_b}$. Теперь рассмотрим реальную ситуацию, когда квантовая яма с центром $z = 0$ расположена вблизи границы раздела $z = -D$ между диэлектриком (вакуумом) и полупроводником, фоновые диэлектрические постоянные которых равны $\varepsilon_1 (z < -D)$ и $\varepsilon_2 = \varepsilon_b (z > -D)$ соответственно. При этом, например, при учете только изменения ширины ямы формуле (21) соответствует следующее выражение:

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{w}(s \rightarrow s)}{d\tilde{\Omega}'} &= \frac{\cos\theta |\cos\theta'|}{\cos\tilde{\theta} |\cos\tilde{\theta}'|} |t_s(\kappa')|^2 |t_s(\kappa)|^2 \\ &\times \frac{\Omega\Gamma_Y(\kappa')}{|\tilde{\Delta}_Y(\kappa')|^2} \frac{\Omega\Gamma_Y(\kappa)}{|\tilde{\Delta}_Y(\kappa)|^2} \\ &\times W(\mathbf{K}', \mathbf{K}) \cos^2 \varphi', \end{aligned} \quad (27)$$

относящееся к рассеянию типа $s \rightarrow s$ из полупроводника. В (27) $d\tilde{\Omega}' = \sin\tilde{\theta}' d\tilde{\theta}' d\varphi'$, причем полярный угол $\tilde{\theta}$ волны, распространяющейся в диэлектрике, связан с углом θ той же волны в полупроводнике законом преломления света $\kappa/k_0 = \sqrt{\varepsilon_b} \sin\theta = \sqrt{\varepsilon_1} \sin\tilde{\theta}$, $k_n(\kappa) = \sqrt{\varepsilon_n k_0^2 - \kappa^2}$ (где $n = 1, 2$), а $t_s(\kappa) = 2k_1 / (k_1 + k_2)$ — коэффициент пропускания s — поляризованной волны поверхностью полупроводника. Во входящих в (27) резонансных знаменателях

$$\tilde{\Delta}_Y(\kappa) = \Delta_Y(\kappa) + i\Gamma_Y(\kappa) r_s(\kappa) \exp(2ik_2 D) \quad (28)$$

второе слагаемое включает дополнительные радиационные поправки к частоте и затуханию экситона по сравнению со знаменателем $\Delta_Y(\kappa)$ из (25). Эти поправки обусловлены интерференционным полем между квантовой ямой и поверхностью образца, а их величина определяется коэффициентом отражения $r_s(\kappa) = (k_1 - k_2) / (k_1 + k_2)$. Как следствие, частота экситонного резонанса и его радиационное затухание, определяющие, согласно (27), положение спектральных пиков и их интенсивность могут испытывать осцилляции, сопоставимые по величине с Γ_Y^0 . Период этих осцилляций определяется фазой

$2k_2D = 2k_0D\sqrt{\varepsilon_b - \varepsilon_1 \sin^2 \theta}$, т.е. он зависит от угла падения θ (рассеяния θ') света и расстояния между квантовой ямой и поверхностью образца D . Из-за изменения коэффициента отражения света в случае p -поляризованной компоненты поля этот эффект модифицируется.

5. Обсуждение результатов

Принципиально важной особенностью полученных выражений (21)–(24) и (27) является их зависимость от параметров неровностей через корреляционные функции (19), (20) и (26). Формально эти выражения применимы к малым неровностям с любой статистикой. Однако тип статистики для реальных гетерограниц неизвестен, поэтому в оценках используются гауссовы корреляционные функции с

$$g_{mn}(|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|) = \exp(-|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^2/\Lambda_{mn}^2), \quad (29)$$

где Λ_{mn} — поперечный радиус корреляции. Гауссова статистика типична для систем с большим числом независимых слабых рассеивателей. Более того, изучение упругого рассеяния света в области экситонных резонансов показало [9], что гауссова статистика пригодна для описания ростовых шероховатых поверхностей полупроводников. Используя (29) в (19), (20) и полагая для простоты, что $g_{mn} = g$, $g_{mn} = gU$, $h_n = h$ и $\Lambda_{mn} = \Lambda$, величину (26) получаем в виде

$$W_G(\mathbf{K}', \mathbf{K}) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\sqrt{\varepsilon_b} k_0 h \Lambda}{\bar{L}} \right)^2 \times \exp\left(-\frac{|\mathbf{K} - \mathbf{K}'|^2 \Lambda^2}{4}\right) (1 - U). \quad (30)$$

На рис. 2 и 3 представлены результаты численного расчета сечений $dw(\lambda \rightarrow \lambda)/d\Omega'$ по формулам (21) для $s \rightarrow s$ и (24) для $p \rightarrow p$ рассеяния света квантовыми ямами GaAs/AlGaAs. В качестве $W(\mathbf{K}', \mathbf{K})$ использованы функции (30) с $U = 0$, соответствующие некоррелированным границам квантовой ямы, для которых $\langle \xi_m \xi_n \rangle = 0$, если $m \neq n$. Показанные на рис. 2 и 3 величины относятся к рассеянию через состояние экситона легкой дырки $1e-1lh$, для которого $\Gamma_Z^0 \neq 0$, в отличие от экситона $1e-1hh$ с $\Gamma_Z^0 \equiv 0$ [10, 11]. Спектры рассеяния (рис. 2) имеют резонансные особенности на частотах экситонов, причем в случае рассеяния $p \rightarrow p$ (рис. 2, *b*) возможно два резонансных состояния с частотами $\omega_X \neq \omega_Z$, но последний резонанс исчезает при $\theta \rightarrow 0$ или $\theta' \rightarrow 0$, когда $\Gamma_Z(\kappa) \rightarrow 0$ в соответствии с (16).

Интенсивность вторичного излучения как функция полярного угла рассеяния θ' (рис. 3) сильно зависит как от поляризации ($s \rightarrow s$ на рис. 3, *a* или $p \rightarrow p$ на рис. 3, *b*), так и от поперечного радиуса корреляции неровностей Λ . При $\Lambda < 1/k_0$ рассеяние в значительной мере изотропно по θ' , и основная часть однократно рассеянного света

остается внутри полупроводника, отражаясь в него от плоской поверхности. Напротив, при $\Lambda > 1/k_0$ излучение концентрируется в сравнительно небольшом угле вблизи направления зеркального отражения, и поэтому основная часть его может выйти из полупроводника.

Целесообразно сравнить величину вычисленных вероятностей рассеяния (рис. 2) с результатами измерений

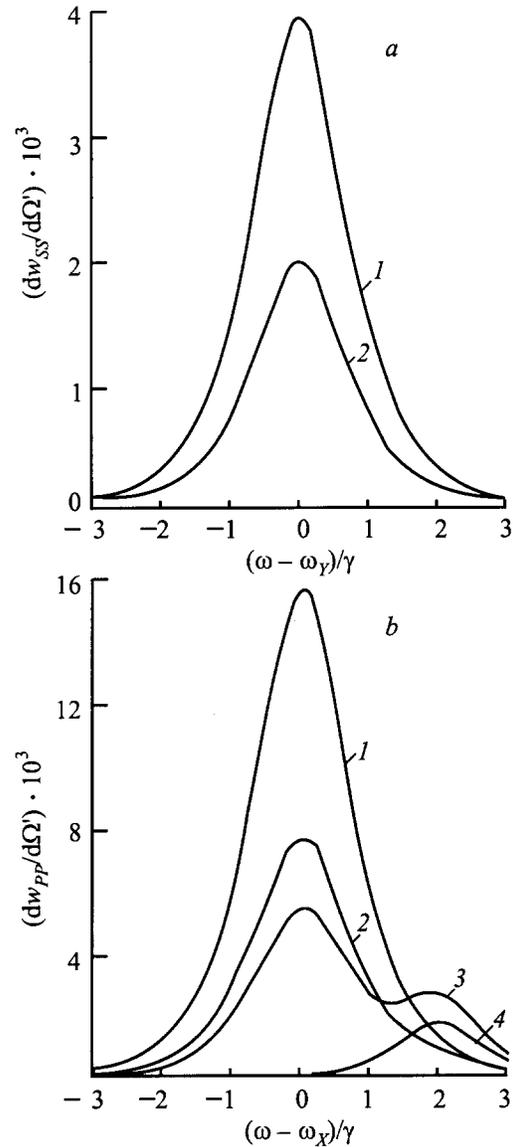


Рис. 2. Безразмерные сечения упругого рассеяния $dw/d\Omega'$ (*a*) типа $s \rightarrow s$ в зависимости от $(\omega - \omega_\gamma)/\gamma$ при $\Lambda = 500 \text{ \AA}$ и (*b*) типа $p \rightarrow p$ в зависимости от $(\omega - \omega_X)/\gamma$ при $\Lambda = 1000 \text{ \AA}$. Рассчитано с $\hbar\Omega = 50 \text{ meV}$ и $h = 2 \text{ \AA}$, $L = 140 \text{ \AA}$, $U = 0$ в формуле (30). Кривые соответствуют следующим наборам углов $(\theta, \theta', \varphi')$ в градусах: (*a*) 1 — (0, 5, 0), 2 — (0, 5, 45) и (*b*) 1 — (5, 10, 0), 2 — (10, 10, 45), 3 — (10, 30, 45), 4 — (10, 30, 90). Используются следующие параметры экситона легкой дырки $1e-1lh$ в квантовой яме GaAs/AlGaAs: $\hbar\gamma = 1 \text{ meV}$, $\hbar(\omega_Z - \omega_X) = 2 \text{ meV}$, $\hbar\Gamma_X^0 = \hbar\Gamma_Y^0 = \hbar\Gamma_Z^0/4 = 0.25 \text{ meV}$ (при $\theta = \theta' = 0$) и $\varepsilon_b = 12.5$.

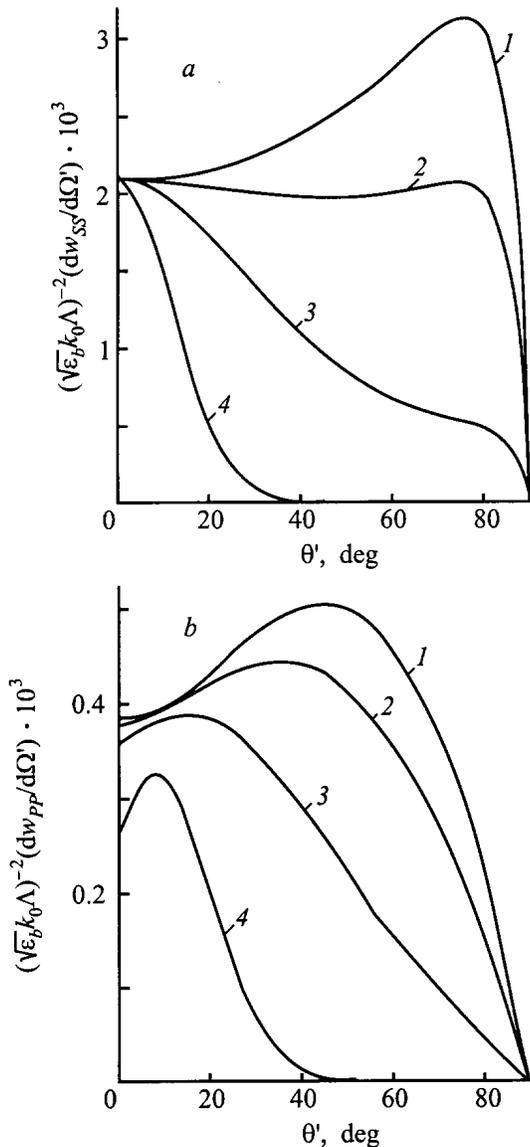


Рис. 3. Зависимости от угла θ' нормированных безразмерных сечений рассеяния $(\sqrt{\epsilon_b k_0 \Lambda})^{-2} dw/d\Omega'$ (a) типа $s \rightarrow s$ при $\omega = \omega_\gamma$, $\theta = 0$, $\varphi' = 0$ и (b) типа $p \rightarrow p$ при $\omega = (\omega_x + \omega_z)/2$, $\theta = 10^\circ$, $\varphi' = 45^\circ$. Кривые соответствуют следующим значениям параметра $\sqrt{\epsilon_b k_0 \Lambda}$: 1 — 0.42 ($\Lambda = 150 \text{ \AA}$), 2 — 1.4 ($\Lambda = 500 \text{ \AA}$), 3 — 2.8 ($\Lambda = 1000 \text{ \AA}$), 4 — 7 ($\Lambda = 2500 \text{ \AA}$). Остальные параметры те же, что на рис. 2.

аналогичных экситонных спектров для статистически шероховатых поверхностей полупроводников [9]. Сравнение приводит к выводу, что рассмотренные выше эффекты должны быть наблюдаемы по интенсивности для квантовых ям, имеющих неровности со среднеквадратичной высотой больше, чем 1 \AA . Теоретические оценки вероятности рассеяния можно существенно повысить, увеличивая множитель $(h\Lambda/\bar{L})^2$ в (30), однако при этом следует иметь в виду принципиальное

условие $\Omega h/\bar{L} \ll \gamma$ применимости построенной выше теории возмущений. Нарушение этого условия означало бы необходимость перехода к модели нерезонансных (локализованных в плоскости квантовой ямы) состояний экситонных поляритонов.

Итак, мы выразили нелокальную экситонную восприимчивость и интенсивность резонансного упругого рассеяния света непосредственно в статистических терминах, характеризующих неровные границы квантовой ямы. В представленной теории эффекты случайных неровностей, ответственные за появление упругого рассеяния света, отделены от эффектов "средней" квантовой ямы, проявляющихся в отражении и пропускании света [3]. Показано, что из двух рассмотренных выше механизмов рассеяния, которые связаны соответственно с вариацией ширины квантовой ямы и с ее изгибом, в общем случае существенным оказывается только первый. Из численных оценок следует, что дифференциальное сечение (вероятность) резонансного упругого рассеяния света в квантовой яме может значительно превышать существующий уровень экспериментальной наблюдаемости [9], если неровности имеют среднеквадратичную высоту атомного масштаба. Поскольку вклады отдельных неровностей гетерограниц в рассеяние света суммируются (с учетом фазовых множителей), то в структурах со многими квантовыми ямами можно ожидать значительного усиления описанных выше эффектов.

Работа была поддержана РФФИ (грант № 96-02-17929).

Список литературы

- [1] S. Schmitt-Rink, D.S. Chemla, D.A.B. Miller. *Adv. Phys.* **38**, 2, 89 (1989).
- [2] E.L. Ivchenko, G.E. Pikus. *Superlattices and other Heterostructures. Symmetry and optical phenomena*. Springer Series in Solid State Sciences. Springer-Verlag, Berlin (1995) V. 110.
- [3] В.А. Кособукин. *ФТТ* **34**, 10, 3107 (1992); Е.Л. Ивченко, А.И. Несвижский, С. Йорда. *ФТТ* **36**, 8, 2118 (1994).
- [4] Ф. Бехштедт, Р.Эндерлайн. *Поверхности и границы раздела полупроводников*. Мир, М. (1990). 484 с.; J. Singh, K.K. Bajaj, S. Chaudhuri. *Appl. Phys. Lett.* **44**, 8, 804 (1984).
- [5] J. Humlicek, E. Schmidt, L. Bocanek, R. Svehla, K. Ploog. *Phys. Rev.* **B48**, 8, 5241 (1993); S. Glutsch, F. Bechstedt. *Phys. Rev.* **B50**, 11, 7733 (1994).
- [6] T. Stroucken, A. Knorr, C. Anthony, A. Schulze, P. Thomas, S.W. Koch, M. Koch, S.T. Cundiff, J. Feldmann, E.O. Gobel. *Phys. Rev. Lett.* **74**, 12, 2391 (1995).
- [7] R. Zimmermann. *Nuovo Cimento* **17D**, 11-12, 1801 (1995); D.S. Citrin. *Phys. Rev.* **B54**, 20, 14572 (1996); R. Zimmermann, E. Runge, F. Grosse. *Proc. 23-rd Int. Conf. Phys. Semicond.* / Ed. M. Scheffler and R. Zimmermann. World Scientific (1996) P. 1935.
- [8] В.А. Кособукин. *Sol. Stat. Com.* **108**, 2, 83 (1998).

- [9] В.А. Кособукин, А.В. Селькин. Письма в ЖЭТФ **44**, 8, 377 (1986); Sol. Stat. Com. **66**, 3, 313 (1988); В.А. Кособукин, М.И. Сажин, А.В. Селькин. ФТТ **32**, 4, 1023 (1990); Sol. Stat. Com. **94**, 11, 947 (1995).
- [10] L.C. Andreani, F. Bassani. Phys. Rev. **B41**, 11, 7536 (1991).
- [11] Е.Л.Ивченко. ФТТ **33**, 8, 2388 (1991).
- [12] E.L. Ivchenko, V.P. Kochereshko, P.S. Kor'ev, V.A. Kosobukin, I.N. Uraltsev, D.R. Yakovlev. Sol. Stat. Com. **70**, 5, 529 (1989).
- [13] G. Bastard, E.E. Mendez, L.L. Chang, L. Esaki. Phys. Rev. **B26**, 2, 1974 (1982); R.L. Greene, K.K. Bajaj, D.E. Phelps. Phys. Rev. **B29**, 4, 1807 (1984); M. Matsuura, Y. Shinozuka. J. Phys. Soc. Jpn. **53**, 9, 3138 (1984).
- [14] V.A. Kosobukin. Phys. Stat. Sol. (b) **208**, 1, 271 (1998).
- [15] A.A. Maradudin, D.L. Mills. Phys. Rev. **B11**, 4, 1392 (1975); D.L. Mills, A.A. Maradudin. Phys. Rev. **B12**, 8, 2943 (1975).